Սամվել Կիմի Շուքուրյան

samshouk@ysu.am

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն
Գիտական ղեկավար
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն
Գիտական ղեկավար
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն
Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

Լեզուների իմացություն

Հայերեն English Русский Українська

Հրապարակումներ

Հոդված
An Extended Efficient Algorithm of Pattern Matching for Partially Commutative Monoids
Samvel Shoukourian, Arsen Asatryan

Pattern Recognition and Image Analysis 2026 152-162

https://10.1134/S1054661825701408

Հոդված
LEARNING METHODOLOGY FOR VALIDATION OF MEMORY BIST SOLUTIONS VIA A SHARED INTERFACE
Samvel Shoukourian, Armen Babayan

ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր տեխնիկական գիտությունների սերիա 2024 69-76

Հոդված
Results of Validation Analysis for Multi-Memory Bus BIST Engines
Samvel Shoukourian, Armen Babayan

2024 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) 2024 1-3 էջ

Հոդված
Repair of Resistive Open Defects on Word-Lines and Bit-Lines of SRAMs
Samvel Shoukourian, Karen Amirkhanyan, Valery Vardanian, Yervant Zorian

2024 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) 2024 1-6 էջ

Հոդված
An Approach for Increasing Memory Repair Efficiency
S. Shoukourian, K. Amirkhanyan, A. Babayan, V. Vardanian, Y. Zorian

2024 IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS) 2024 1-6

Հոդված

Analytics for AI Related Applications of Multidimensional Multitape Finite Automata
Samvel SHOUKOURIAN, Tigran GRIGORYAN, Sevak AMIRKHANYAN

Frontiers in artificial intelligence and applications 2023 49-60

Հոդված

Functional Safety Compliant Test & Repair Framework for System-on-Chip Lifecycle Management
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, G. Tshagharyan, Y. Zorian

Mathematical Problems of Computer Science 2021 7-17

Արտոնագիր

DETECTION OF ADDRESS ERRORS IN MEMORY DEVICES USING MULTI-SEGMENT ERROR DETECTION CODES
Samvel Shoukourian, Gurgen Harutyunyan, Hayk Grigoryan, Grigor Tshagharyan, Yervant Zorian

2021

Հոդված

Polynomial algorithm for equivalence problem of deterministic multitape finite automata
Samvel K. Shoukourian, Hayk A. Grigoryan

Theoretical Computer Science 2020 120-132

Հոդված

Memory Physical Aware Multi-Level Fault Diagnosis Flow
SAMVEL SHOUKOURIAN, GURGEN HARUTYUNYAN, SUREN MARTIROSYAN, YERVANT ZORIAN

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 2020 700-711

Հոդված

Fault Awareness for Memory BIST Architecture Shaped by Multidimensional Prediction Mechanism
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, Y. Zorian

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 2019 562-575

Գիտաժողովի նյութ

Armenia: Communicating to World Community in Electronic Test and Design
Samvel Shoukourian, Yuri Shoukourian, Vladimir Sahakyan

2019 1-3

http://www.guide2research.com/conference/itc-2019

Արտոնագիր

FINFET-BASED MEMORY TESTING USING MULTIPLE READ OPERATIONS
Samvel Shoukourian, Gurgen Harutyunyan, Grigor Tshagharyan, Yervant Zorian

2019

Հոդված

Experimental study on Hamming and Hsiao Codes in the Context of Embedded Applications
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, G. Tshagharyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 25-28

Հոդված

Automated Flow for Test Pattern Creation for IPs in SoC

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, D. Sargsyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 21-24

Հոդված

An Efficient Testing Methodology for Embedded Flash Memories
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, S. Martirosyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 422-425

Հոդված

Security Issues in Test and Repair Infrastructure for Systems-on-Chip
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, G. Tshagharyan

Информационно-коммуникационные технологии в науке, производстве и образовании ICIT-2017 2017 114-122

Արտոնագիր

Testing Electronic Memories Based on Fault and Test Algorithm Periodicity
S. Shoukourian, G. Harutyunyan, V. Vardanian, A. Hakhumyan, Y. Zorian

2017

Գիտաժողովի նյութ

Securing Test Infrastructure of System-on-Chips
S. Shoukourian, G.Tshagharyan, G.Harutynyan, Y.Zorin

2016 29-32

http://ieee.org.ua/2016/02/03/ewdts-2016/

Գիտաժողովի նյութ

An efficient approach for memory repair by reducing the number of spares.
Valery A. Vardanian, Samvel K. Shoukourian, Vrezh Sargsyan, Avetik Yessayan, Yervant Zorian

2015 21-25

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7488713

Գիտաժողովի նյութ

A power based memory BIST grouping methodology.
Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Lusine Martirosyan, Yervant Zorian

2015 27-30

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7488713

Գիտաժողովի նյութ

Overview study on fault modeling and test methodology development for FinFET-based memories.
Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Grigor Tshagharyan, Yervant Zorian

2015 19-22

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7488713

Գիտաժողովի նյութ

Extending fault periodicity table for testing faults in memories under 20nm.
Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Valery A. Vardanian, Yervant Zorian

2014 5-9

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7000956
